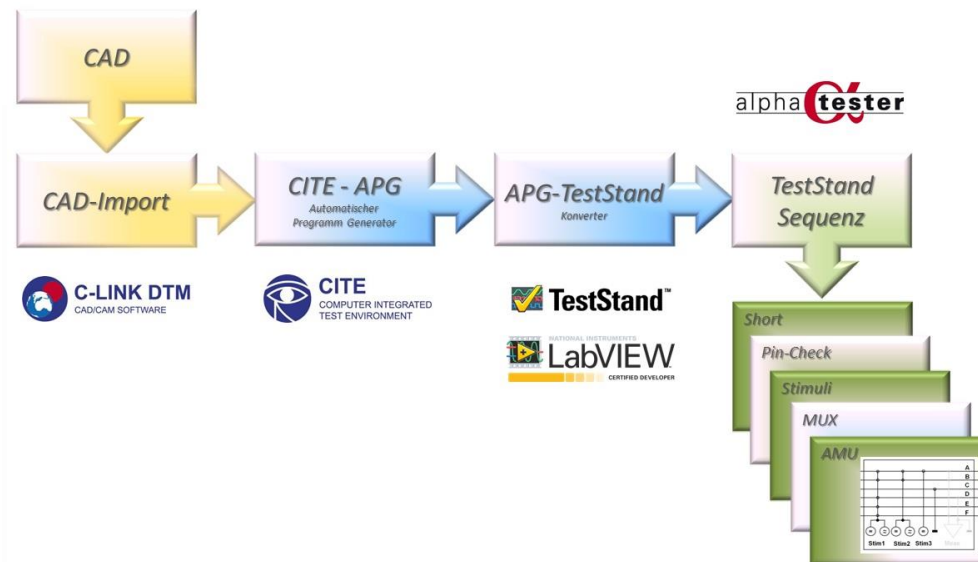




easyGEN - Verschmelzung von In-Circuit Test und Funktionstest mit TestStand und LabVIEW

Unser *alphatester_{SUITE}* Softwarepaket wird mit easyGEN um eine revolutionäre Programmumgebung erweitert.



easyGEN - Struktur für die In-Circuit Test Programmgenerierung mit CITE von Digitaltest GmbH

Mit dem easyGen Softwaretool von ad+t AG werden in Verbindung mit dem In-Circuit-Test von Digitaltest GmbH die mit CITE-APG (Automatischer Programm Generator) generierte Analogener- und/oder Digitalen ICT-Prüfprogramme in TestStand-Sequenzen konvertiert. Der Zugriff auf alle relevanten Parameter und Ergebnisse der ICT Routinen erfolgt über StepTypes welche in LabVIEW erstellt sind.

Für den automatischen Ablauf eines Funktionstests hat sich LabVIEW und TestStand von National Instrument weitgehend durchgesetzt, und ICT-Testsysteme haben sich auf dem Markt etabliert. Durch die Verschmelzung von FKT & ICT ist es ein Muss, eine einheitlich Programmiersprache für die beiden Prüfmethoden zur Verfügung zu stellen und dabei 30 Jahre know how in FKT und ICT von ad+t AG zu vereinen.

Vorteile der Kombination der beiden Prüfmethoden

- Integration des ICT und FKT auf einen Prüfadapter
- Nutzung von gemeinsamer Hardware
- Reduzierung der Handlingszeit

Vorteile der einheitlichen Programmiersprache

- Eine Programmiersprache für ICT und FKT
- Dieselbe Benutzeroberfläche fürs Debugging
- Übersichtlicher Testbetrieb
- Durchgängiges protokollieren der Testergebnisse



ad+t AG

Automated Design + Test

Motorenstr. 36 CH-8620 Wetzikon
 info@adt.ch Tel. +41 44 937 52 80
 www.adt.ch Fax +41 44 937 53 10

- Prüftechnologie
- Leiterplattendesign
- Qualitätsmanagement

news@adt

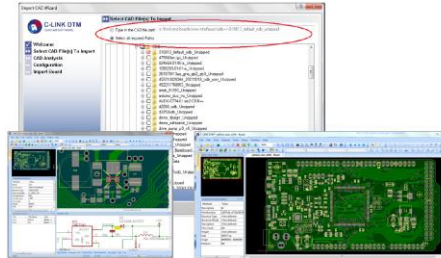
www.adt.ch



In 5 Schritten zum Prüfprogramm:

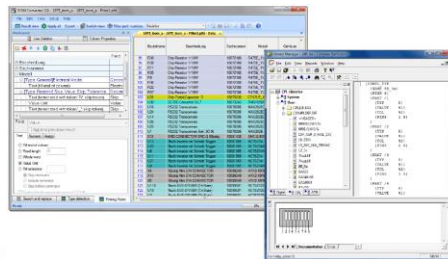
Schritt 1: CAD/BOM-Daten Import & Kontaktierbarkeitsprüfung

- Automatischer CAD- und BOM-Import
- Bestückvarianten generieren
- Anzeige nicht kontaktierbarer Netze im Schaltplan und Layout
- Überprüfung des Einflusses fehlender Zugriffspunkte
- Entscheidung für den Test von Bauteile in Reihe oder im Clustertest
- Unterstützung bei der Analyse der Testbarkeit



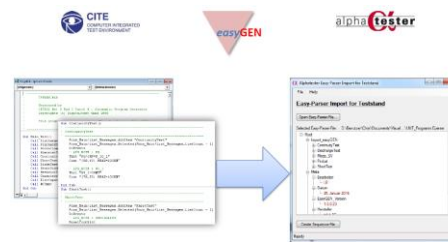
Schritt 2: APG - Automatische Programm Generierung

- Schaltungsexpansion (Komplexe-Bauteile)
- Explizite Schaltungsanalyse und detaillierte Reports: was wird wie oder warum nicht getestet
- Erkennen und Behandeln paralleler Strukturen
- Auto-Guard: Berechnung von empfohlenen Guard-Punkten
- Berechnung empfohlener Stim-/Meas-Parameter



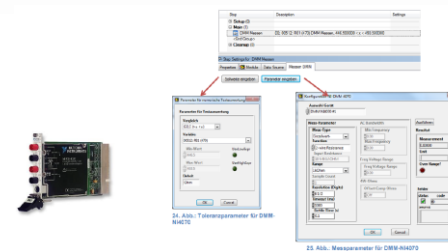
Schritt 3: easyGEN-Parser - Konvertierung des APG in TestStand

- Einfaches Debuggen, Parametrieren mit StepTyps auf LabVIEW basis
- komfortables Einfügen von ICT Prüfschritte
- Gleiche Programmiersprache für ICT und FKT
- Einheitliche Testergebnis Protokollierung
- Vereinheitlichte Repairdatenbank der verschiedenen Prüftechnologien



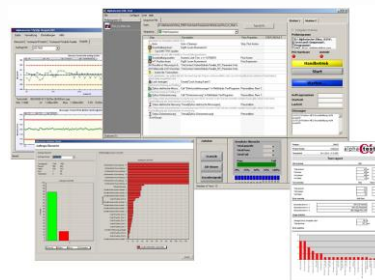
Schritt 4: Prüfprogramm Debugging

- Leistungsfähiges Debugging mit TestStand
- Einzelschritt-Modus verfügbar.
- Debug-Fenster zur Anzeige der Messergebnisse.
- Alle Parameter können verändert und die Auswirkungen direkt sichtbar gemacht werden.
- Der Layout- und Scheman-Viewer sowie die Hervorhebung fehlerhafter Komponenten erleichtern das Debuggen.



Schritt 5: Testbetrieb, Reparaturstation, Report

- Schnelle Fehlerdiagnose und Reparatur
- Ermöglicht Analyse, um Leistung und Qualität zu verbessern
- Sichtprüfungsstationen mit Checklisten
- Prozessüberwachung mit autom. Serienfehlererkennung
- Intelligente Reparatur-Datenbank
- Umfangreiche statistische Reports



news@adt

www.adt.ch

Publikation: April 2016
Autor: Marco Weidmann



adt AG
Automated Design + Test
Motorenstr. 36 CH-8620 Wetzikon
info@adt.ch Tel. +41 44 937 52 80
www.adt.ch Fax +41 44 937 53 10

- Prüftechnologie
- Leiterplattendesign
- Qualitätsmanagement